Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/791,724	CHEN, YUEHTING
Examiner	Art Unit

Hwei-Siu C. Payer

3724

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
030	370	6-24-05	Pager
į	371		
	373		
	377		
	390		
	388		
	391		
451	358		
	359		
	451		
	452		
	455		
144	251.1		

INT	INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner	
			:	

(INCLUDING SEARC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del>,</del>
	DATE	EXMR
		-
		:
		<del> </del>
•		
		<del>                                     </del>